

**Journée Thématique du réseau R&D semi-conducteurs - Effets des irradiations dans les détecteurs semi-conducteurs**

ID de Contribution: **0**

Type: **Non spécifié**

## **Capteurs HVCMOS pour SLHC**

*jeudi 16 juin 2016 11:00 (30 minutes)*

**Orateur:** BARBERO, Marlon (CPPM)